

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 03120367 PUBLICATION DATE : 22-05-91

APPLICATION DATE : 03-10-89 APPLICATION NUMBER : 01258494

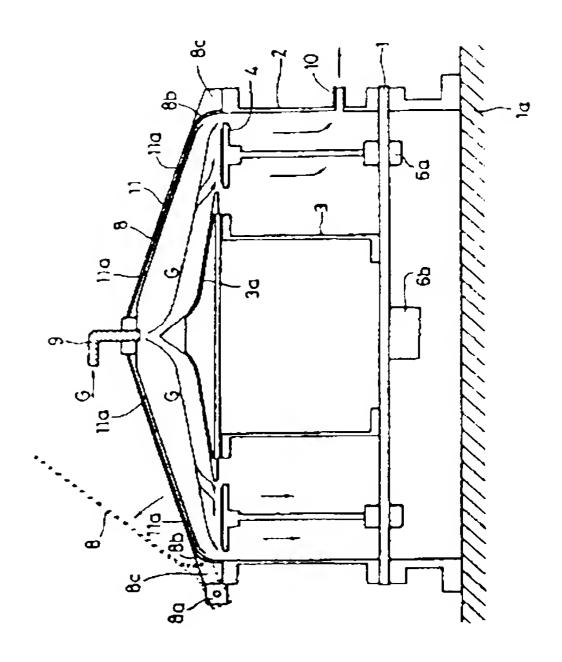
APPLICANT: HITACHI ELECTRON ENG CO LTD;

INVENTOR: OGURA TAKESHI;

INT.CL. : C23C 16/44 H01L 21/31

TITLE : COVERING LID FOR CVD REACTION

FURNACE

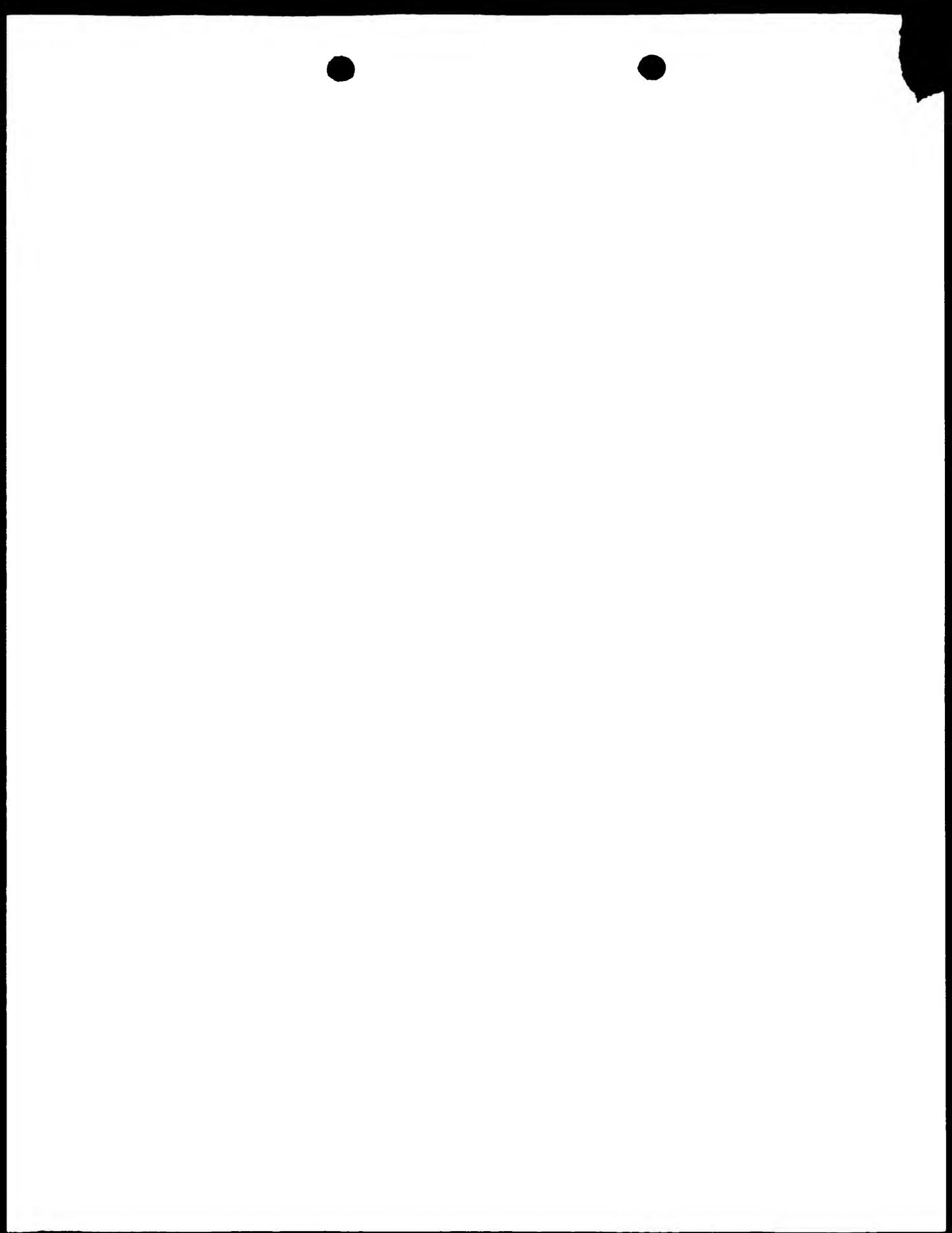


ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent the turbulence of a gaseous reactant and to easily clean the covering lid by forming a gently bent part at the periphery of the lid having a gaseous reactant supply port for a bell jar-type reaction furnace and furnishing an auxiliary lid easy to attach and detach to its inner surface.

CONSTITUTION: An inner housing 3 having a conical buffer 3a at its upper part is arranged in a cylindrical outer housing 2. Plural turntables 4 carrying a wafer to be treated, rotating and revolving are set between both housings. The covering lid 8 having a supply port 9 for the gaseous reactant G and made openable and closable by a hinge 8a is provided at the upper part of the outer housing 2, and an exhaust port 10 for the reacted gas is furnished. In this bell jar-type CVD reaction furnace, a gently bent part 8b joining the inner side face of the outer housing 2 is provided on the periphery of the lid 8. Consequently, the turbulence of the gaseous reactant G on the wafer surface is prevented, and a good-quality thin film is formed. Furthermore, the auxiliary lid 11 is easily detachably provided on the inside of the lid 8 through a mount 11a, and the lid 8 is easily cleaned.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-120367

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)5月22日

C 23 C 16/44 H 01 L 21/31

8722 - 4K6940-5F \mathbf{B}

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

CVD反応炉の覆い蓋

頤 平1-258494 ②特

頤 平1(1989)10月3日 忽出

倉 烟発 明 者 小

武

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

日立電子エンジニアリ ⑪出 顧 人

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

ング株式会社

外1名 弁理士 梶山 佶是 少代 理 人

切 知 净

1. 兇明の名称 CVD反応がの狙い蓋 2,特許請求の範囲

(1) 円筒形をなす外筐体の内部に、上部に山形の パッファを行する円筒形の内閣体を行し、上記外 筐体と該内管体の間に、被処理のウェハを兼置し て自公転する複数のターンテーブルを備え、上記 外院体の上部に反応ガスに対する供給口を付する 開閉可能な難い蓋と、上記外筐体の下部に反応流 みガスに対する排気口をそれぞれ設けてなるベル フィー型CVD反応がにおいて、上記程い差の周 辺部に上記外院体の内側面に接続する附らかな資 曲部を設けて 上記ウェハの表面をプローする上記 反応ガスに発生する乱流を防止し、かつ、該費い 盗の内面に密貫して召脱容易な補助蓋を設けたこ とを特徴とする、CVD反応炉の粗い蓋。

3.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、ベルジャー型CVD反応かの扱い 遊の構造に関するものである。

[従来の技術]

半導体ICは、シリコンウェハに反応ガスを作 用させて酸化シリコンの薄膜を生成して製造され る。薄膜の生成方法には化学気相成長法(CVD) が有用である。CVD法には当初の常圧法から、 これを改良した誠正法やプラズマ法などがあるが、 常圧法も盛んに使用されている。常圧法は、常圧 の雰囲気の下でウェハを400~500° Cに加 熱し、その表面に対して、反応ガス(モノシラン S i H 4 + 酸素 O 2) にキャリヤーガス (空素 N 2)を混合したものをフローして酸化シリコン (SiO2)を生成するものである。

最近においては I C の需要が著しく増加し、こ れに対応して多量のウェハを同時に処理できる人 容量の常圧CVD反応炉が開発されている。

第3図(a),(b) は、従来使用されているペルジ ャー型の常圧CVD反応炉の要部を示す。図(a) において、床面1x に固定されたペース1には、 川筒形の外院体2が固定され、この内部に同心円 の内院体3が設けられている。外院体2と内障体

特開平3-120367(2)

3の間に、被処理のウェハ5を被置して自公転す る複数個のターンテーブル4が円周上に配列され ており、各ターンテーブル4は回転機構68 によ り自転するとともに、回転機構Bbにより公転す る。このような自公転は反応ガスが各ウェハ5に 対してできる限り均等に反応するためのものであ る。図(b) はターンテーブル4の配列を示す平面 図でターンテーブル4が15個の場合を示し、矢 用R」は自転を、Rkは公転を示す。一方、全方 间に対して反応ガスを一様に分配するために、内 筐体3の上部に山形のバッファ32と、これに対 応するやはり山形の狙い蓋8がそれぞれ設けられ たもので、山形の間い蓋8により反応炉は全体と してベルジャー型をなしている。反応ガスのプロ 一経路について述べると、預い蓋8の上部に設け られた供給口8より供給された反応ガスGは、質 い蓋と8パッファ3 の間を放射状に拡散し、各 ウェハ5の表面をフローして反応作用がなされる。 反応済みの残留ガスは外筐体2の下部に設けられ た排気口10より外部に排出される。なお、覆い蓋

8はヒンジ8aにより開閉自由とされ、これを開放した状態でウェハのローディング/アンローディングや、内部の消損が行われる。

[解決しようとする課題]

上記の第2図(a)の反応炉における覆い蓋8は、山形の傾斜角がバッファ3aの裾部分の傾斜角とはぼ同一とされており、両者の間に反応ガスに対する面路を構成するために、覆い蓋8の周辺部と外管体2との間に中間リング7を介在して覆いる。中間リング7を介在してでいる。中間リング7の内側にであるので、反応が2日である。である。でである。ででは近近が2日である。ででは近近が2日では近近が2日でででででででででである。でが2日に入り混って、そこに乱流が発生する。でが2日に入り混って、そこに乱流が発生する。でがましくない。また、反応ガスが衝突した中間リング7の内側面には酸化物などの異物が付着し易いなどの欠点がある。

次に、CVD反応炉は稼働に伴って、煎い蓋8、中間リング7をはじめ、内部の各機構部分に対し

この発明は、以上に鑑みてなされたもので、従 米の反応炉において中間リングでの付近に発生した反応ガスの乱流を防止するとともに、情掃作業 の容易な粗い蓋の構造を提供することを目的とす るものである。

[課題を解決するための手段]

この発明は、円筒形をなす外管体の内部に、上部に山形のバッファを有する円筒形の内管体を有し、外管体と内管体の間に、被処理のウェハを被置して自公転する複数のターンテーブルを確え、外管体の上部に反応ガスに対する供給口を有する開閉可能な難い蓋を、またその下部に反応済みガスに対する排気口をそれぞれ設けたベルジャー型CVD反応炉における置い蓋であって、置い蓋の周辺部に外管体の内側面に接続する州らかな流曲

部を設け、ウェハの表面をフローする反応ガスに 発生する乱流を防止する。また、難い蓋の内面に 密符して符脱容易な補助蓋を設けたものである。 [作用] 及び[実施例]

第1図により上記した粗い蓋の構造とその作用を説明する。前記した第3図(a)における、短い蓋8と外筐体2の間に介在した中間リング7を脱止し、その代わりに覆い蓋8の周辺部に資血部8 bを設けて支持リング8cにより支持する。適由部8 b は外筐体2の内側面に円滑に接続されており、これにより、覆い蓋8とバッファ3aの間をフローして周辺部に達した反応がスGは、方向が満次に下方に変わってスムースな流れとなり、乱流が発生せず反応作用に行利であり、また児物の付許が軽減される。なお、覆い蓋8の開閉は、支持リング8cと外筐体2の上部とをヒンジ8aにより結合して行われる。

次に、第1回において、担い蓋8の内側に、担い蓋8と同形の薄い金属板による補助蓋目を密着させ、適当な取り付け具11mにより者脱容易に取

特開手3-120367(**3)**

り付ける。反応炉の稼働により生じた鬼物は選い 番8には付着せず補助蓋目に付着する。反応炉の 清掃作業においては短い蓋8を上方に開放し、補 助蓋目を取り外してこれを清掃する。これにより 従来必ずしも容易でなかった狙い蓋8そのものの 清掃が省略される。

第2回は、この発明によるCVD反応炉の粗い 遊の実施例における構造を示すもので、ベルジャー型反応炉は、床面18に固定されたベース1に 対して円筒形の外管体2と、これと同心円の内 体3を行し、それらの中間の円周上に自公転する 複数のターンテーブル4が配列されており、自 転は同転機構68,6bにより行われることは、対 起した第3回(a)、(b) と同様である。これに対し て、超い 直8の周辺部に第1回に従って、資価部 8bを設け、これを支持リング8cにより支持する。支持リング8cの一箇所と外管体2の間をヒ ンジ8cにより結介して担い 蓋8を開閉する。

反応炉を稼働する場合は、買い置8の上端の供 給119より供給された反応がスGは、パッファ3 aにより全方向に放射状に広がってターンテーブル4に被置されたウェハ5に反応作用をなし、反応後の残留ガスは従来と同様に排気口10より外部に排出される。この場合、複い蓋8の周辺部に設けられた跨曲部8bにより反応ガスに乱流が発生せず反応作用に行利であり、また異物の付置が経過されることは前記した通りである。

次に、同様に第1図に従って、超い蓋8の内側に対して、超い蓋8と同形で金属の薄板製の補助 盗口を密召し、適当な取り付け具11aにより脊脱 自由に取り付けたもので、消损するときは置い蓋 8を開放し、補助盗口を取り外してこれを清掃する。

[発明の効果]

以上の構成による型い蓋においては、狙い蓋8の周辺部付近における反応ガスのフローは、湾曲部8 b により乱流の発生が防止されるとともに、済制作業に関しては、従来の中間リングが廃止されて簡易化され、また補助叢口を済量することにより、従来容易でなかった狙い蓋8の清量作業が

省略できるもので、ベルジャー型CVD反応炉におけるウェハの酸化作用の均一化と落構作業の効率化に寄写する効果には入きいものがある。

4.図面の簡単な説明

第1図は、この発明によるCVD反応炉の扱い 盗の構造と作用に対する説明図、第2図は、この 発明によるCVD反応炉の難い蓋の実施例におけ る構造図、第3図(a) および(b) は、従来のベル ジャー型CVD反応炉の要部の構造図である。

1 ... ~ - 7,

1 a …床面、

2 …外馆体、

3 …內筐体、

3 2 ... パッファ、

4…ターンテーブル、

5…被処型ウェハ、

62,85 …间层数据、

7…中間リング、

8…数い海、

82 …ヒンジ、

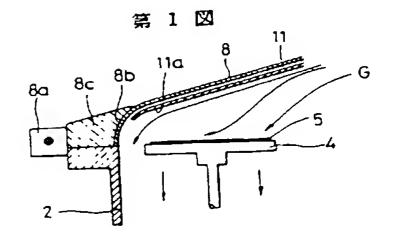
86 …清明部、9 …供給口、

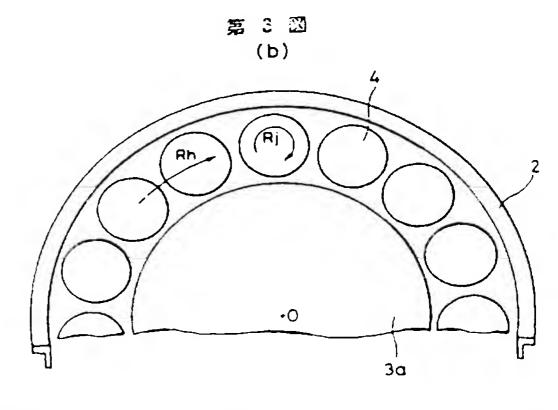
10…排気口、

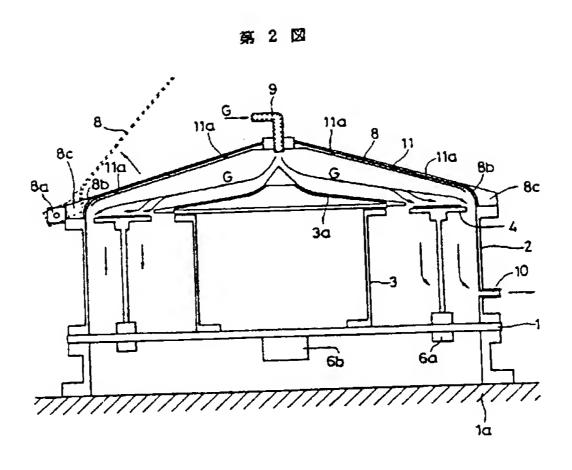
11…抽助益、

112 …取り付け以。

8 c … 支持リング、







\$ 3 \(\text{Q}\) (a)